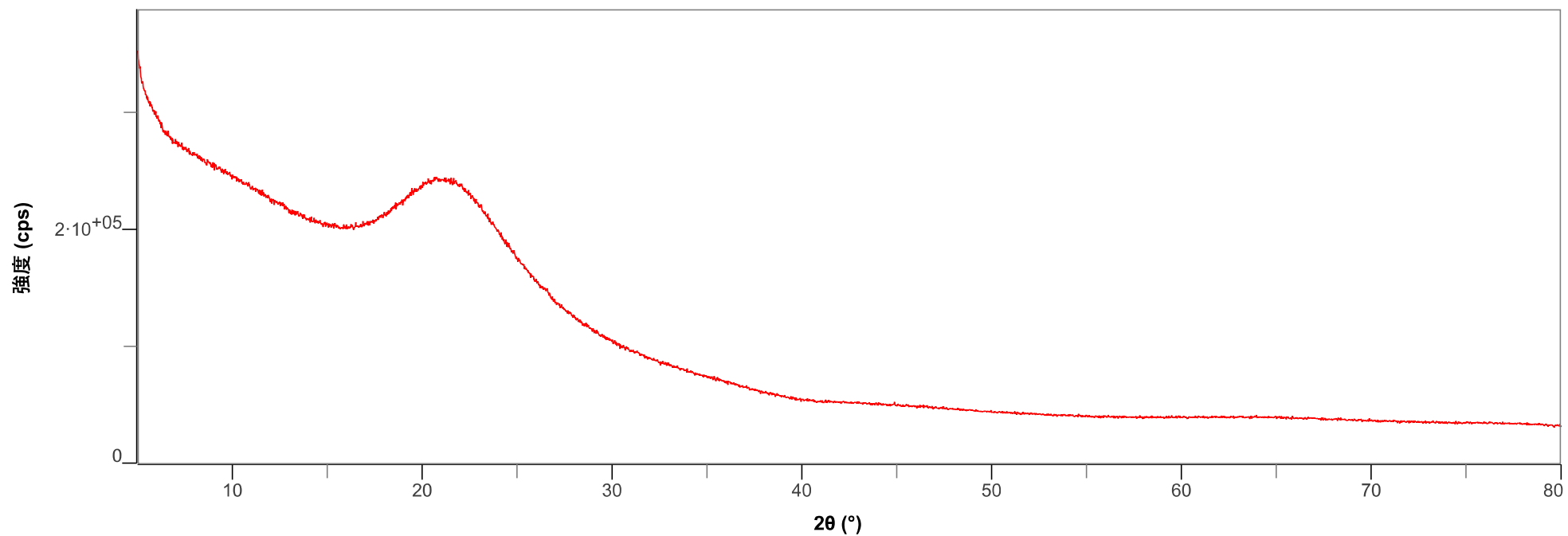


もみ殻シリカ粉末-ピーク評価・相同定レポート (もみ殻シリカ粉末)

測定条件

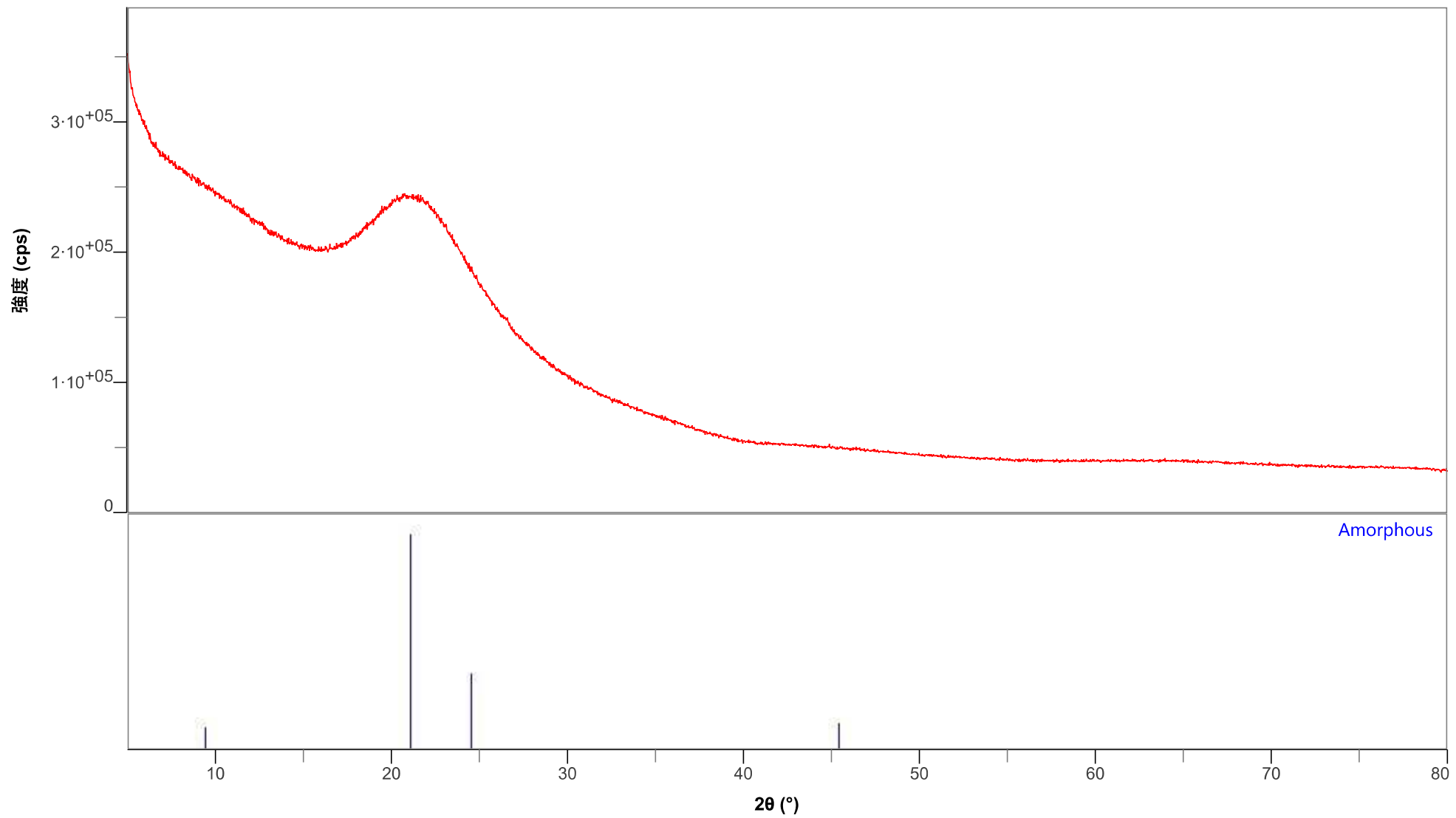
X線発生装置	45 kV, 200 mA	スキャンモード	1D(スキャン)
プライマリビーム	標準	スキャン速度/計数時間	10.00 °/min
ゴニオメーター	標準ゴニオメーター	ステップ幅	0.02 °
アタッチメント	ASC-6アタッチメント (反射配置)	スキャン軸	2θ/θ
フィルター	Cu用Kβフィルター 1D	スキャン範囲	5 ~ 80 °
選択スリット	BB	入射スリットボックス	2/3°
検出器モノクロメーター	なし	長手制限スリット	10 mm
検出器	D/teX Ultra250	受光スリットボックス1	Open
光学系属性	BB	受光スリットボックス2	Open

測定プロファイルビュー



もみ殻シリカ粉末-ピーク評価・相同定レポート (もみ殻シリカ粉末)

結晶相データビュー



ピークリスト

No.	2 θ (°)	d (Å)	高さ (cps)	FWHM (°)	積分強度 (cps°)	積分幅 (°)
1	9.43(19)	9.37(18)	5261(30)	4.1(2)	29402(1844)	5.6(4)
2	21.13(3)	4.201(6)	49427(290)	5.40(19)	284230(1372)	5.75(6)
3	24.55(11)	3.623(16)	16897(113)	5.6(6)	101440(77643)	6(5)
4	45.41(4)	1.9955(16)	4170(54)	8.08(10)	36609(416)	8.8(2)